YS32 MCU 在线调试器
使用说明

深圳市汇春科技股份有限公司

2026-11

1.概述

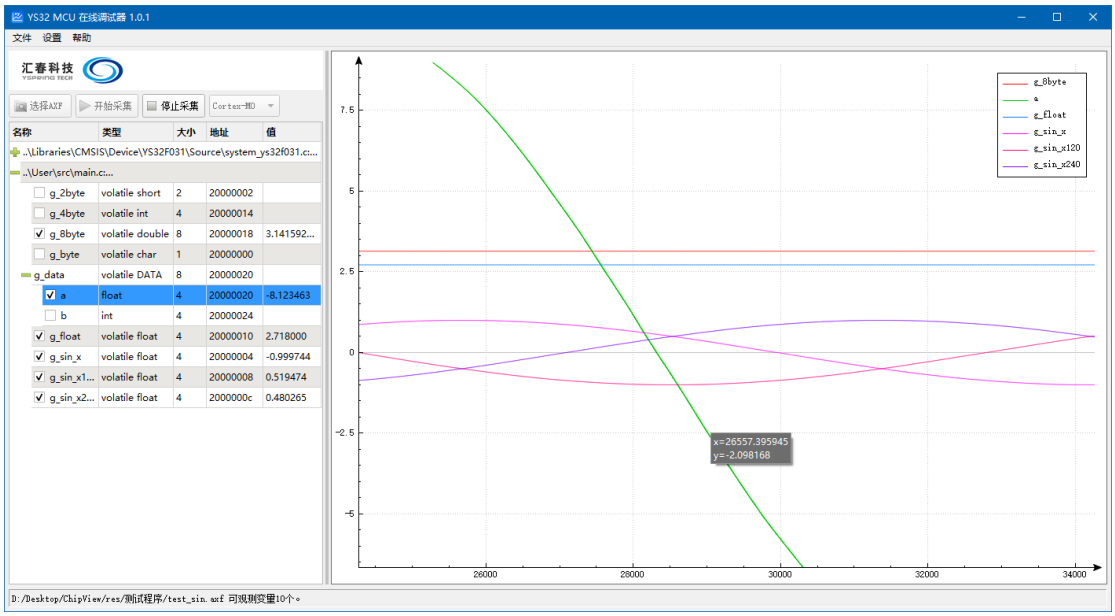
YS32 MCU 在线调试器（以下简称 ChipView）是用于 Cortex-M 系列 MCU 的调试工具软件。

1.1 功能简介

ChipView 支持打开.axf,.elf 格式的文件，读取其中的变量信息。通过 JLINK 仿真器与目标芯片连接，非侵入式（无需修改工程代码）的查看及修改变量的值。该软件可以方便的查看数据变化波形。

ChipView 的数据采样率为 1000 次/秒。数据采集时长无限制。

1.2 软件的主界面



2.基本用法

2.1 打开 AXF 文件

点击主界面的“选择 AXF”按钮，选择要打开的 AXF 文件（MDK ARMCC 编译）或 ELF 文件（GCC 编译）。

打开成功后，ChipView 会列出项目源文件名称，以及所有未被优化的全局变量（包括结构体变量）。

2.2 添加要监视的变量

勾选需要查看/监视的变量。

2.3 采集数据

首先用 JLINK 的 SWD 接口连接到目标芯片。点击“开始采集”按钮。

2.4 修改变量数据

在“值”这一列，双击要修改的变量，填写新的值。按回车键或焦点离开文本框后生效。

2.5 波形界面的操作方法

注意：数据采集期间，图像不能平移，X 轴不能缩放。

2.5.1 平移

在波形区，按下左键可以拖放平移。

2.5.2 整体放大缩小

在波形区，可以使用滚轮放大缩小。

2.5.3 X 轴放大缩小

点击 X 轴，看到 X 轴变蓝色后，可以使用滚轮单独放大缩小 X 轴。在波形空白处点击，回到整体放大缩小模式。

2.5.4 Y 轴放大缩小

点击 Y 轴，看到 Y 轴变蓝色后，可以使用滚轮单独放大缩小 Y 轴。在波形空白处点击，回到整体放大缩小模式。

2.5.5 高亮选中曲线

在图像曲线上单击，可以高亮显示当前曲线。
在图例上点击曲线名称，也可以高亮显示对应的曲线。

3.数据导入和导出

当 ChipView 处于停止采集状态，可以通过文件菜单中的“导入”和“导出”保存或查看采集到的数据。文件格式为 CSV。

4.软件设置


Settings
仿真器(Link):
jlink
仿真器速率(kHz):
10MHz
采样率(点/秒):
1000
实时刷新点数:
3000
OK
Cancel